半導体レーザを有する光集積回路とビットシフト回転法を 用いた物理乱数生成

Physical random number generation with a photonic integrated circuit and bit-shift rotation method

埼玉大 ¹, NTT CS 基礎研 ², 早稲田大 ³, ⁰宇賀神 上総 ¹, 寺島 悠太 ¹, 内田 淳史 ¹, 原山 卓久 ^{2,3}, 吉村 和之 ²

Saitama Univ.¹, NTT CS Lab.², Waseda Univ.³,

[°]K. Ugajin¹, Y. Terashima¹, A. Uchida¹, T. Harayama^{2,3}, and K. Yoshimura²

E-mails: {s14mm305, auchida}@mail.saitama-u.ac.jp

はじめに:近年、高速な不規則振動を生じるレ ーザカオスを物理乱数源として用いた物理乱数 生成の研究が報告されている[1]。従来の研究に おいて、レーザカオスを用いた物理乱数生成装 置は光学定盤上に設置されており、実用化のた めには小型化が必要となる。これまでに、光集 積回路を用いたレーザカオス発生部の小型化が 報告されている[2]。また、乱数生成処理部にお いて、レーザカオスを電気信号に変換する AD 変換器の量子化誤差によるランダム性の低下を 軽減する必要がある。これまでに、量子化誤差 の影響を軽減する手法として差分法[3]が提案 されている。また、乱数のランダム性を向上さ せる手法としてビットシフト回転法[4]が提案 されている。しかしながら、二つの手法を組み 合わせてレーザカオスに適用した研究は未だ報 告されていない。

そこで本研究では、光集積回路で生成された レーザカオス波形に対して差分法とシフトビッ ト回転法を組み合わせた乱数生成方式を適用し て物理乱数生成を行うことを目的とする。

実験方法と結果:本研究で用いるレーザカオス 発生用光集積回路は、半導体レーザ、二つの光 増幅器、長さが 10.3 mm の導波路、外部鏡、お よび光検出器により構成されている。レーザか ら出力された光は外部鏡により反射され、戻り 光として再びレーザに注入される。これにより Fig.1(a)に示すようなレーザカオス波形が生じ る。レーザカオスは光集積回路内の光検出器に より電気信号として出力される。また、本光集 積回路から得られたレーザカオスの振幅の出現 確率のヒストグラムを Fig.1(b)に示す。ヒストグ ラムは正規分布に似た形状を示している。しか しながら、レーザカオスの振幅の出現頻度のヒ ストグラムは、AD 変換器の量子化誤差により 特定の振幅の出現頻度が高く、不連続的である。 そこで差分法を用いることにより、ヒストグラ ムの平坦化を行う。

ここで乱数生成処理について説明する。レー ザカオス波形からそれぞれ異なる遅延時間を有 する三つの遅延波形を生成する。レーザカオス 波形と一つ目の遅延波形間および二つ目と三つ 目の遅延波形間で差分を行うことで二つの差分 信号を得る。次に一つ目の差分信号に対し、8 ビットごとに n ビットシフト回転を行う(n = 1, 2,4) [4]。以上により、二つの差分信号と1 ビッ ト、2 ビット、4 ビットシフト回転信号が得られ る。最後に五つの信号の個別ビット間で排他的 論理和を行うことで乱数列を生成する。

生成した乱数のランダム性を NIST 検定[5]お よび Test U01 検定[6]を用いて評価した。全ての 検定項目に合格した乱数は真性乱数と統計的に 区別不可能とされる。本手法で生成した乱数は 全ての検定項目に合格することができた。



Fig.1 (a) Chaotic temporal waveform of photonic integrated circuit. (b) Probability distribution of chaotic temporal waveform.

まとめ:本研究では、光集積回路で生成された レーザカオス波形に対して、差分法とビットシ フト回転法を組み合わせた乱数生成方式を適用 することで乱数を生成した。生成した乱数のラ ンダム性をNIST検定とTest U01検定を用いて評 価したところ、全ての検定項目に合格できた。

参<u>考文献</u>

- [1] A. Uchida, et al., Nat. Photonics, **2**, 728 (2008).
- [2] R. Takahashi, et al., Opt. Express, **22**, 11727(2014).
- [3] I. Reidler, et al., Phys. Rev. Lett, **103**, 024102 (2009).
- [4] M. Dichtl, Lect. Not. Comput. Sci, 4593, 137 (2007).
- [5] A. Rukhin et al., NIST. Special Publication 800-22, Revision 1a (2010).
- [6] P. L' Ecuyer et al., ACM Trans. Math. Soft, 33, 22 (2007)